X-RAY PROJECTING AND ALIGNER

Publication number: JP2001060547 (A)

Publication date:

2001-03-06

Inventor(s):

OSHINO TETSUYA +

Applicant(s):

NIPPON KOGAKUKK +

Classification:

- international:

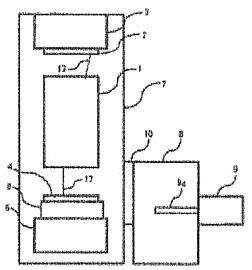
G03F7/20; H01L21/027; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/20; H01L21/027

- European:

Application number: JP19990235128 19990823 Priority number(s): JP19990235128 19990823

Abstract of JP 200 1060547 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an X-ray projection aligner, which is provided with a wafer absorbing mechanism and a wafer carrying mechanism or a mask absorbing mechanism and a mouse-carrying mechanism suitable for the X-ray projection aligner. SOLUTION: In this aligner, a voltage is supplied to a wafer suction member 6, and the wafer suction member 6 is fixed to a carriage arm 9a, in a state that a wafer 4 is held by electrostatic suction. The wafer 4 and the wafer sucking member 6 are moved to a wafer stage 5 by the carriage arm 9a, and the carriage arm 9a is descended or the wafer stage 5 is ascended so that the wafer suction member 6 can be placed on the wafer stage 5. A voltage is supplied to the wafer suction member 6, the wafer sucking member 6 is fixed to the wafer stage 5, and at last the fixing of the carriage arm 9a and the wafer sucking member 6 is released, so that the carriage arm 9a can be withdrawn.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-60547 (P2001 - 60547A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51) Int.Cl.7		觀別記号	F I	デーマコート*(参考)
HOIL	21/027		H 0 1 L 21/30	531A 2H097
G03F	7/20	503	G03F 7/20	503 5F046

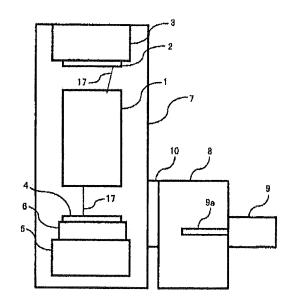
		審査請求 未請求 請求項の数15 〇L (全 11 頁)
(21)出廣番号	特顧平11-235128	(71)出願人 000004112 株式会社ニコン
(22)出顧日	平成11年8月23日(1999.8.23)	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 押野 哲也 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 Fターム(参考) 2H097 CA15 DA06 DB07 GB01 LA10 5F046 CD04 GA03 GA11 GA12 GA14

(54) 【発明の名称】 X線投影螺光装置

(57)【要約】

【課題】X線投影露光装置に適したウエハ吸着機構およ びウエハ搬送機構あるいは、マスク吸着機構およびマス ク搬送機構を具備したX線投影露光装置を得る。

【解決手段】ウエハ吸着部材6に電圧を供給して静電吸 着によりウエハ4を保持させた状態で、前記ウエハ吸着 部材6を搬送アーム9aに固定し、次に、ウエハ4とウ エハ吸着部材6を搬送アーム9aによりウエハステージ 5上に移動させ、さらに搬送アーム9 aを下降させるか あるいは、ウエハステージ5を上昇させることによっ て、ウエハ吸着部材6をウエハステージ5上に載置し、 ウエハ吸着部材6に電圧を供給し、前記ウエハ吸着部材 6を前記ウエハステージ5に固定し、最後に搬送アーム 9 a とウエハ吸着部材6 との固定を解除し搬送アーム9 aを退避させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】X線源と、該X線源から発生するX線を所定のバターンを有するマスク上に照射する照明光学系と、前記マスクからのX線を受けて前記パターンの像をウエハ上に投影結像する投影結像光学系と、前記ウエハを保持するウエハステージと、前記投影結像光学系と前記ウエハステージと前記マスクステージと真空に保つ真空チャンバとを有するX線投影露光装置において、ウエハを静電力で吸着するウエハ吸着部材と、複数のウエハをストックす 10るウエハ格納室と、ウエハを前記ウエハ格納室から前記ウエハステージへ撤送する搬送機構とを具備することを特徴とするX線投影露光装置。

1

【請求項2】前記搬送機構が、ウエハを前記ウエハ吸着 部材の所定位置で吸着した状態で、該ウエハ吸着部材を 搬送することを特徴とする請求項1 に記載のX線投影露 光装置。

【請求項3】前記ウエハ吸着部材が、誘電体と該誘電体に埋め込まれた一つあるいは複数の電極と該電極に電圧を供給するための電圧入力端子とから構成され、該電圧 20入力端子を一つの電極に対して少なくとも2つ以上設け、前記ウエハステージおよび前記搬送機構に、前記ウエハ吸着部材に設けられた電圧入力端子に電圧を供給する電圧出力端子を設け、前記ウエハステージあるいは前記搬送機構に設けられた電圧出力端子のうち、少なくとも一つの電圧出力端子から前記ウエハ吸着部材に電圧を供給することを特徴とする請求項1または、請求項2に記載のX線投影露光装置。

【請求項4】前記ウエハ吸着部材の一部に磁性体を配置し、前記ウエハステージの一部および前記搬送機構の一部に磁力発生部を設けて、該磁力発生部に発生させた磁力で前記磁性体を保持することにより、前記ウエハ吸着部材を前記ウエハステージあるいは前記搬送機構に固定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項5】前記ウエハ格納室に真空排気機構を設け、前記ウエハ格納室と前記真空チャンパの間にゲートバルブを設け、前記真空チャンパを真空状態に保ったまま前記ウエハ格納室を真空あるいは大気圧状態に保つことができることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれ 40かに記載のX線投影露光装置。

【請求項6】前記撤送機構にウエハ吸着部材を回転させる機構を設けたことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項7】X線源と、該X線源から発生するX線を所定のバターンを有するマスク上に照射する照明光学系と、前記マスクからのX線を受けて前記バターンの像をウエハ上に投影結像する投影結像光学系と、前記マスクを保持するマスクステージと、前記ウエハを保持するウエハステージと、前記投影結像光学系と前記マスクステ 50

ージと前記ウエハステージを真空に保つ真空チャンバとを有するX線投影露光装置において、マスクを静電力で吸着するマスク吸着部材と、複数のマスクをストックするマスク格納室と、マスクを前記マスク格納室から前記マスクステージへ搬送する搬送機構とを具備したことを特徴とするX線投影露光装置。

【請求項8】前記搬送機構が、マスクを前記マスク吸着 部材の所定位置で吸着した状態で、該マスク吸着部材を 搬送するととを特徴とする請求項7に記載のX線投影露 光装置。

【請求項9】前記マスク吸着部材が、誘電体と該誘電体に埋め込まれた一つあるいは複数の電極と該電極に電圧を供給するための電圧入力端子とから構成され、該電力入力端子を一つの電極に対して少なくとも2つ以上設け、前記マスクステージおよび前記搬送機構に、前記マスク吸着部材に設けられた電圧入力端子に電圧を供給する電圧出力端子を設け、前記マスクステージあるいは前記搬送機構に設けられた電圧出力端子のうち、少なくとも一つの電圧出力端子から前記マスク吸着部材に電圧を供給することを特徴とする請求項7または請求項8に記載のX線投影露光装置。

【請求項10】前記マスク吸着部材の一部に磁性体を配置し、前記マスクステージの一部および前記撤送機構の一部に磁力発生部を設けて、該磁力発生部に発生させた磁力で前記磁性体を保持することにより、前記マスク吸着部材を前記マスクステージあるいは前記撤送機構に固定することを特徴とする請求項7から請求項9のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項11】前記マスク格納室に真空排気機構を設け、前記マスク格納室と前記チャンバの間にゲートバルブを設け、前記チャンバを真空状態に保ったままで前記マスク格納室を真空あるいは大気圧状態に保つことができることを特徴とする請求項7から請求項10のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項12】前記搬送機構にマスク吸着部材を回転させる機構を設けたことを特徴とする請求項7から請求項11のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項13】請求項1から請求項6のいずれかに記載のX線投影露光装置において、請求項7から請求項12のいずれかに記載のマスク吸着部材とマスク格納室と搬送機構とを具備することを特徴とするX線投影露光装

【請求項14】前記誘電体が、セラミックスであることを特徴とする請求項3から請求項6のいずれか、または請求項9から請求項13のいずれかに記載のX線投影露光装置。

【請求項15】前記ウエハ吸着部材またはマスク吸着部材に、電極を少なくとも2つ以上設け、該電極の少なくとも一つに、他の電極に供給される電圧とは異なる電圧を供給することを特徴とする請求項1から請求項14の

3

いずれかに記載のX線投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえばX線光学系等のミラープロジェクション方式によりフォトマスク (マスクまたはレチクル)上の回路バターンを反射型の結像光学系を介してウエハ等の基板上に転写する際に好適な装置であるX線投影露光装置に関するものである。 【0002】

【従来の技術】従来からの半導体製造用の露光装置は、 フォトマスク(以下、マスクと称する)面上に形成され た回路パターンを、結像装置に設けられた投影結像光学 系を介して、ウエハ等の基板上に投影転写するものであ る。前記露光装置には、たとえば露光光源にi線を用い た露光装置などがあり、該露光装置は、光源と、照明光 学系と、投影結像光学系と、マスクを保持するステージ と、ウエハを保持するステージと、焦点検出機構とから 構成されている。該焦点検出機構は、ウエハ上に斜めに 光束を照射して、その反射光束を光検出器で検出すると とにより、前記ウエハ髙さを知るととができる。また、 マスクにはウエハに描画するパターンの等倍あるいは拡 大バターンが形成されている。投影結像光学系は通常、 複数のレンズ等で構成され、前記マスク上のパターンを 前記ウエハ上に結像して一括転写できるようになってお り、約20mm角の視野を有しているため、所望の領域 (例えば、半導体チップ2チップ分の領域)を一括で露 光するととができる。

[00003]近年、半導体集積回路の高集積化、高性能化がさらに進み、解像力の向上が必要となってきた。一般に、露光装置の解像力Wは、主に露光波長入と結像光 30学系の開口数NAで決まり、次式で表される。

W= k₁ λ / N A k₁ : 定数

したがって、解像力を向上させるためには、上式の分子 側にある波長を短くするかあるいは分母側の開口数を大 きくすることが必要となる。

【0004】また、上記のような従来の半導体露光装置では、投影結像光学系の焦点位置近傍で高い解像力を得られるように設計されており、ウエハはその露光する表面位置を投影結像光学系の焦点位置近傍に配置されている。投影結像光学系が高い解像力を示す範囲(光軸方向の長さ)を焦点深度(DOF)と称する。焦点深度は主に露光波長入と結像光学系の開口数NAで決まり、次式で表される。

【0005】DOF= $k,\lambda/NA^i$ k_i :定数 現在、半導体露光装置の露光光源には前述の通り、主に 波長365 n mの i 線が使用されており、開口数を0. 5とすると0.5 μ mの解像力と1.5 μ mの焦点深度 が得られる。とこで開口数を大きくすれば、解像力を向 上させることができるが逆に焦点深度を浅くしてしまう ことになり、さらに光学設計上あるいは装置製造上に無 50

理を生じるため、露光光の短波長化が必要となってきた。たとえば、i線より短波長の露光光としてエキシマレーザー光であれば、その波長は、KrFで248 nm、ArFで193 nmと短波長であり、KrFでは 0.25 μ m、ArFでは0.18 μ mの解像力が得られる。そして、露光光としてさらに波長の短いX線、たとえば波長13 nmを用いれば、開口数を0.1 にすると 0.1 μ m以下の解像力を得ることが可能となり、焦点深度もi線とほぼ同等の1.3 μ mが得られる。

【0006】また、従来からの投影露光装置は前述の通り、ウエハ上で約20mm程度の視野を有するため、マスクおよびウエハは少なくとも露光する範囲において十分な平坦度を有していることが好ましい。しかし、シリコンウエハ等のウエハは厚さが高々1mm程度しかないため、ウエハ自身の反り等によりμmオーダー程度の平坦度しか得られない。そこで、露光時にウエハ表面を平坦に保つような機構が必要であった。一方マスクは一般的に厚さ数mmのガラス板を基盤として作製されるため、ウエハに比べるとよい平坦度を有している。しかし、マスクに対しても、それが充分平坦に保たれるような保持機構が必要であった。そこで、保持する接触面を高精度な平面度に仕上げた真空チャック部材でウエハおよびマスクを吸着することによって、マスクおよびウエハを弾性変形させて、その表面を平坦に保つことができた。

【0007】従来のi線やエキシマレーザー光を用いた 露光装置におけるウエハ搬送手順を、図10を用いて説 明する。図10はウエハ44をウエハ格納部51からウ エハステージ45に搬送する手順を示している。まず、 ウエハ格納部51にあるウエハ44を搬送アーム50a に真空チャック(不図示)を用いて吸着させる(図10 a)。次に、ウエハ44をウエハステージ45に固定さ れるウエハ吸着部材49の上方に移動する(図10b)。 次に、ウエハステージ45内に配置されたウエハ受け渡 し機構52を駆動して、受け渡しアーム52aでウエハ 44の裏面の一部を真空チャック(不図示)を用いて吸 着する(図10c)。最後に、ウエハ搬送アーム50aの 真空吸着を解除して、ウエハ44から搬送アーム50a を退避させて、ウエハ受け渡しアーム52aを降下させ ることによりウエハ44をウエハ吸着部材49の上に乗 せる。ウエハ吸着部材49に設けられた真空チャック (不図示)の吸着力によりウエハ44はウエハステージ 45に保持される。

【0008】また、ウエハ44をウエハステージ45からウエハ格納部51に搬送する場合には、上記の逆の手順をとる。同様に露光装置がマスク格納部を具備している場合には、必要に応じて露光に使用するマスクをマスク吸着部材に吸着させて、前記マスク格納部からマスクステージまで搬送して交換することができる。

【0009】次に、現在試験的に考えられているX線投 影露光装置の概略図を図9に示す。本装置は、X線源3 1と、照明光学系32と、マスク33を保持するマスクステージ34と、投影結像光学系35と、ウエハ36を保持するウエハステージ37と、前記投影結像光学系35と前記マスクステージ34とウエハステージ37の環境を真空にするための真空チャンバ38とから構成される

【0010】マスク33には描画するパターンの等倍あるいは拡大パターンが形成されている。投影結像光学系35は複数の反射鏡等で構成されており、マスク33上のパターンをウエハ36上に縮小投影結像するようになっている。各反射鏡の表面にはX線の反射率を高めるために多層膜が設けられている。投影結像光学系35は輪帯状の視野を有し、マスク33の一部における輪帯状の領域のパターンを、ウエハ36上に転写する。露光の際には、マスク33とウエハ36を一定速度で同期走査させることによって、所望の領域(例えば、半導体チップ1個分の領域)を露光できるようになっている。

【0011】 X線には、多層膜で高い反射率が得られる 13nm程度の軟X線が用いられるが、このような軟X 線は空気による吸収が大きい。そこで、X線の光路が真 20 空中に保たれるように、少なくともマスクとウエハと投 影結像光学系35を真空チャンバ38内に配置し、該真 空チャンバ38内を真空ポンプ(不図示)で排気している。

【0012】マスクステージおよびウエハステージは真 空中で髙精度に駆動するものが好ましく、磁気ステージ やビエゾステージなどが用いられる。X線を用いた露光 方法においても、従来のi線を用いた露光方法と同等 に、ウエハの表面にはレジストが塗布されており、ウエ ハを搬送する際にとのレジストを剥離あるいは汚染させ てはならない。そのため、ウエハはその裏面を吸着保持 することが好ましい。マスクも、その表面に微細で脆弱 な回路バターンが形成されているため、やはり、その裏 面を吸着保持するととが望ましい。前述の通り、従来か らの露光装置におけるウエハ搬送機構あるいはマスク搬 送機構には、ウエハあるいはマスクをアームに真空吸着 して搬送する機構が採用されてきた。ところが、X線投 影露光装置はウエハおよびマスクを真空中に配置しなく てはならないため、従来から用いられてきた真空チャッ ク吸着方式では、吸着保持することができない。そこ で、真空中においても大きな吸着力が得られる静電吸着 方式が考えられ、従来と同様にウエハおよびマスクを搬 送アームに吸着して搬送し、図10に示したような受け 渡し機構を用いることになる。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記搬送機構ではウエハおよびマスクを裏面で保持できるという利点があるものの、ウエハ吸着部材やウエハステージの内部あるいはマスク吸着部材やマスクステージの内部 に複雑な受け渡し機構を設けなければならない。また、

上述のようにX線投影露光装置のウエハステージおよびマスクステージには、磁気ステージあるいはピエゾステージが用いられるため、これらのステージ内部に前述の受け渡し機構を設けることは、構造的に複雑になり困難であるという問題点もあった。

【0014】本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、X線投影露光装置に適したウェハ吸着機構およびウエハ搬送機構あるいは、マスク吸着機構およびマスク搬送機構を具備したX線投影露光装置を提供することを目的としている。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を達成するために、請求項1に記載のX線投影露光装置では、X線源と、該X線源から発生するX線を所定のバターンを有するマスク上に照射する照明光学系と、前記マスクからのX線を受けて前記パターンの像をウエハ上に投影結像する投影結像光学系と、前記ウエハを保持するウエハステージと、前記投影結像光学系と前記ウエハステージと前記マスクステージと、前記投影結像光学系と前記ウエハステージと前記マスクステージを真空に保つ真空チャンバとを有するX線投影露光装置において、ウエハを静電力で吸着するウエハ吸着部材と、複数のウエハをわずるウエハな着いをよりないる。

【0016】請求項2に記載のX線投影露光装置では、請求項1に記載の搬送機構が、ウエハを前記ウエハ吸着部材の所定位置に吸着した状態で、該ウエハ吸着部材を搬送することを特徴としている。請求項3に記載のX線投影露光装置では、請求項1または、請求項2に記載のX線投影露光装置において、前記ウエハ吸着部材が、誘電体と該緊電体に埋め込まれた一つあるいは複数の電極と該電極に電圧を供給するための電圧入力端子とから構成され、該電圧入力端子を一つの電極に対して少なくとも2つ以上設け、前記ウエハステージおよび前記搬送機構に、前記ウエハ吸着部材に設けられた電圧人力端子に電圧を供給する電圧出力端子を設け、前記ウエハステージあるいは前記搬送機構に設けられた電圧出力端子のうち、少なくとも一つの電圧出力端子から前記ウエハ吸着部材に電圧を供給することを特徴としている。

【0017】請求項4に記載のX線投影露光装置では、請求項1から請求項3のいずれかに記載のX線投影露光装置において、前記ウエハ吸着部材の一部に磁性体を配置し、前記ウエハステージの一部および前記搬送機構の一部に磁力発生部を設けて、該磁力発生部に発生させた磁力で前記磁性体を保持するととにより、前記ウエハ吸着部材を前記ウエハステージあるいは前記搬送機構に固定することを特徴としている。

【0018】また、請求項5に記載のX線投影露光装置 50 では、請求項1から請求項4のいずれかに記載のX線投

影露光装置において、前記ウエハ格納室に真空排気機構 を設け、前記ウエハ格納室と前記真空チャンバの間にゲ ートバルブを設け、前記真空チャンバを真空状態に保っ たまま前記ウエハ格納室を真空あるいは大気圧状態に保 つことができることを特徴としている。

【0019】請求項6に記載のX線投影露光装置では、 請求項1から請求項5のいずれかに記載のX線投影露光 装置において、前記搬送機構にウエハ吸着部材を回転す る機構を設けたことを特徴としている。さらに、請求項 7に記載のX線投影露光装置では、X線源と、該X線源 から発生するX線を所定のパターンを有するマスク上に 照射する照明光学系と、前記マスクからのX線を受けて 前記パターンの像をウエハ上に投影結像する投影結像光 学系と、前記マスクを保持するマスクステージと、前記 ウエハを保持するウエハステージと、前記投影結像光学 系と前記マスクステージと前記ウエハステージを真空に 保つ真空チャンパとを有するX線投影露光装置におい て、マスクを静電力で吸着するマスク吸着部材と、複数 のマスクをストックするマスク格納室と、マスクを前記 マスク格納室から前記マスクステージへ搬送する搬送機 20 構とを具備したことを特徴としている。

【0020】請求項8に記載のX線投影露光装置では、 請求項7に記載のX線投影露光装置において、前記搬送 機構が、マスクを前記マスク吸着部材の所定位置に吸着 した状態で、該マスク吸着部材を搬送することを特徴と している。請求項9に記載のX線投影露光装置では、請 求項7または請求項8に記載のX線投影露光装置におい て、前記マスク吸着部材が、誘電体と該誘電体に埋め込 まれた一つあるいは複数の電極と該電極に電圧を供給す るための電圧入力端子とから構成され、該電力入力端子 を一つの電極に対して少なくとも2つ以上設け、前記マ スクステージおよび前記搬送機構に、前記マスク吸着部 材に設けられた電圧入力端子に電圧を供給する電圧出力 端子を設け、前記マスクステージあるいは前記搬送機構 に設けられた電圧出力端子のうち、少なくとも一つの電 圧出力端子から前記マスク吸着部材に電圧を供給すると とを特徴としている。

【0021】請求項10に記載のX線投影露光装置で は、請求項7から請求項9のいずれかに記載のX線投影 露光装置において、前記マスク吸着部材の一部に磁性体 を配置し、前記マスクステージの一部および前記搬送機 構の一部に磁力発生部を設けて、該磁力発生部に発生さ せた磁力で前記磁性体を保持することにより、前記マス ク吸着部材を前記マスクステージあるいは前記搬送機構 に固定することを特徴としている。

【0022】請求項11に記載のX線投影露光装置で は、請求項7から請求項10のいずれかに記載のX線投 影露光装置において、前記マスク格納室に真空排気機構 を設け、前記マスク格納室と前記チャンバの間にゲート

前記マスク格納室を真空あるいは大気圧状態に保つこと ができることを特徴としている。

【〇〇23】また請求項12に記載のX線投影露光装置 では、請求項7から請求項11のいずれかに記載のX線 投影露光装置において、前記撤送機構にマスク吸着部材 を回転する機構を設けたことを特徴としている。請求項 13に記載のX線投影露光装置では、請求項1から請求 項6のいずれかに記載のX線投影露光装置において、請 求項7から請求項12のいずれかに記載のマスク吸着部 材とマスク格納室と搬送機構とを具備することを特徴と している。

【0024】請求項14に記載のX線投影露光装置で は、請求項3から請求項6のいずれか、または請求項9 から請求項13のいずれかに記載のX線投影露光装置に おいて、前記誘電体が、セラミックスであることを特徴 としている。請求項15に記載のX線投影露光装置で は、請求項1から請求項14のいずれかに記載のX線投 影露光装置において、前記ウエハ吸着部材またはマスク 吸着部材に、電極を少なくとも2つ以上設け、該電極の 少なくとも一つに、他の電極に供給される電圧とは異な る電圧を供給することを特徴としている。 [0025]

【発明の実施の形態】本発明によるX線投影露光装置の 概略図を図1に示す。本装置は、X線源(不図示)と、 照明光学系(不図示)と、投影結像光学系1と、マスク2 を保持するマスクステージ3と、前記ウエハ4を吸着す る吸着部材6と、前記吸着部材6を保持するウエハステ ージ5と、前記投影結像光学系1と前記マスクステージ 3と前記ウエハステージ5とを真空に保つためのチャン バ7と、ウエハをストックするウエハ格納室8と、前記 ウエハ4およびウエハ吸着部材6を搬送する搬送機構9 とを有する。

【0026】マスク2には描画するバターンの等倍ある いは拡大バターンが形成されている。投影結像光学系1 は複数の反射鏡等で構成され、マスク2上のパターンを ウエハ4上に結像するようになっている。投影結像光学 系1は輪帯状等の視野を有し、マスク2の一部における 領域のバターンを、ウエハ4上に転写する。露光の際 は、前記マスク2とウエハ4をそれぞれマスクステージ 3 およびウエハステージ5 により一定速度で同期走査さ せることによって、所望の領域を露光できるようになっ ている。

【0027】本装置は、X線を露光光として用いるため に、真空中で露光を行わなければならず、少なくとも投 影結像光学系1と、マスクステージ3と、ウエハステー ジ5を真空チャンバ7内に配置しなければならない。と とで、ウエハ4を交換する際に、真空チャンパ7の真空 雰囲気を大気圧の状態にもどしてウエハ4交換していて は、前記真空チャンパの排気に時間がかかり装置のスル パルブを設け、前記チャンパを真空状態に保ったままで 50 ープットが低くなる。そとで、本装置では図1に示すよ

うにウエハ格納室8も真空チャンバ構造とし、さらにウエハ格納室8と真空チャンバー7の間にゲートバルブ10を設けている。ウエハ4を露光装置内に搬入する際には、まずウエハ格納室8のみを大気圧状態にして、その中にウエハを装着する。次に、ウエハ格納室8を排気して所望の真空状態にする。この間、ゲートバルブ10は閉じておいて、真空チャンバ7は真空状態を保てるようにする。ウエハ格納室8は真空チャンバ7に比べて容積が小さいので、より短い時間で排気することができる。さらに、ウエハ格納室8を排気している間も、真空チャンバー7内で露光することが可能なため、露光装置のスルーブットを高くすることが可能なため、露光装置のスルーブットを高くすることが可能なため、露光装置のスルーブットを高くすることが可能なため、な光装置のスループットを高くすることが可能なため、アートバルブ10を開けてウエハをウエハ格納室8から真空チャンバー7内に搬送する。

【0028】前記ウエハ搬送機構9は、搬送アーム9a にウエハ吸着部材6を保持できる機構(後述)を設けて おり、ウエハ4をウエハ吸着部材6に吸着させた状態で 前記ウエハ吸着部材6と一緒に搬送することができる。 ウエハ吸着部材6を搬送する際に、搬送アーム9aはウ エハ吸着部材6の裏面以外の場所、たとえば側面を保持 して搬送することもできる。また、前記ウエハ吸着部材 6をウエハステージ5に載置する際には、搬送アーム9 aでウエハ4を吸着保持したウエハ吸着部材6をウエハ ステージ5の上部まで搬送し、前記搬送アーム9aを上 下に駆動させるかまたは、ウエハステージ5を上下に駆 動させることによって、ウエハ吸着部材6をウエハステージ5上に載置することができる。その結果、従来のよ うな複雑な受け渡し機構が不要になるという利点がある。

【0029】露光の際には、レジスト(不図示)を塗布したウエハ4をウエハ吸着部材6で吸着保持し、さらに該ウエハ吸着部材6をウエハステージ5上の所定の位置に配置して固定する。ウエハ吸着部材6は静電力でウエハ4を吸着し、真空中においてもウエハ4を保持できるようになっている。さらに、ウエハ吸着部材6のウエハ4と接触する吸着面は高精度に平坦な平面に加工されている。その結果、反りの大きいウエハを用いても、吸着後のウエハ表面は充分な平坦度になり、ウエハの露光面を投影結像光学系1の焦点深度の範囲内に収めることが 40できる。

【0030】次に、図6を用いて、ウエハ吸着部材6、ウエハ搬送アーム9a、ウエハステージ5の構造を説明する。(電極が一つの単電極の場合図6a、複数の場合図6b)

ウエハ吸着部材6は誘電体とその中に埋め込まれた電極21で構成されている。前記電極21に電圧を供給することにより静電吸着力が発生する。さらに、ウエハ吸着部材6には2つ以上の電圧入力端子22a、22bが設けてあり、これらは誘電体に埋め込まれた配線23a、

23 bにより電極21と接続している。とれらの電圧入 力端子の少なくとも一つに電圧を供給すると、ウェハ吸 着部材に静電力が発生する。ウエハステージ5には、電 圧入力端子22aに電圧を供給するための電圧出力端子 24 aおよび配線25 aが設けてある。また、ウエハ搬 送アーム9 aにも、電圧入力端子22 bに電圧を供給す るための電圧出力端子24bと配線25bが設けてあ る。配線25 a、25 bの他端は電源 (不図示)に接続 されている。前記誘電体の材料としては酸化アルミニウ ム等のセラミックスがよい。該セラミックスは機械的強 度が大きいという特徴に加え、真空中における脱ガス量 を抑えることができる。また、セラミックス中の金属不 純物量を極力小さくすることができるため、ウエハを吸 着する際に発生するウエハへの金属汚染を抑えることが でき、後工程のエッチングプロセスに悪影響を及ぼすと とがない。

【0031】さらに、ウエハ吸着部材6をウエハステージ5あるいは搬送アーム9aに固定する手段としては、たとえば磁力を用いるとよい。ウエハステージ5および搬送アーム9aの一部に磁力発生部材26a、26bを設けて、該磁力発生部材で磁力を発生させてウエハ吸着部材6に設けた磁性体27を保持して、ウエハ吸着部材6をウエハステージ5あるいは搬送アーム9aに固定するととができる。前記磁力発生部材26a、26bを電磁石にすると磁力を制御できるので好ましいが、ウエハ吸着部材6の固定方法は磁力に限定されるものではない。たとえば搬送アームの先端に機械式のつかみ機構を設けて、ウエハ吸着部材6を固定してもよい。

【0032】ととで、本発明によるウエハの搬送手順の 30 一例を図4および図7を用いて詳細に説明する。まず、 上述したように静電吸着方式により、ウエハ吸着部材6 にウエハ4を保持させた状態で、ウエハ吸着部材6を搬 送アーム9aに固定する(図4a)。この時、図7aに 示すように電圧入力端子22bと電圧出力端子24bを 接触させてウエハ吸着部材6に電圧を供給して静電吸着 により、ウエハ4はウエハ吸着部材6に保持される。ま た該ウエハ吸着部材6の磁性体27と搬送アーム9aの 磁力発生部材26 b により、前記ウエハ吸着部材6は搬 送アーム9aに固定される。次に、ウエハ4とウエハ吸 着部材6を搬送アーム9aによりウエハステージ5上に 移動させ、さらに、図4bに示すように搬送アーム9a を下降させるかあるいは、ウエハステージ5を上昇させ ることによって、ウエハ吸着部材6をウエハステージ5 上に載置し、電圧入力端子22aと電圧出力端子24a を接触させて、ウエハ吸着部材6に電圧を供給する(図 7b)。そして、該ウエハ吸着部材6の磁性体27とウ エハステージ5の磁力発生部材26aにより、前記ウエ ハ吸着部材6は前記ウエハステージ5に固定される。さ らに、搬送アーム9 a の電圧出力端子2 4 b への電圧供 50 給を切るとともに、搬送アーム9aの磁力発生部材26

bの磁力を消滅させて、ウエハ吸着部材6との固定を解 除し、搬送アーム9 a を退避させる(図4 c、図7 c)。 【0033】上記のような、手順をとることによってウ エハ吸着部材6をウエハステージ5に固定する場合と、 搬送アーム9aに固定する場合のいずれも場合において も、常にウエハ吸着部材6の電極に電圧を供給すること ができ、ウエハ4を常にウエハ吸着部材6に吸着保持し た状態でウエハ4を搬送することができる。また、本発 明によるウエハの搬送手順の別の例を図5を用いて説明 する。上記の図4に示した例では、搬送機構9の駆動部 をウエハ格納室8の外側に設けたが、本例では真空チャ ンバ7内に搬送機構15を設けている。まず、図5 a に 示すように、ウエハ吸着部材6にウエハを静電吸着して 保持した状態で、ウエハ吸着部材6を搬送アーム15a に上述のような磁力等で固定する。 さらに、ウエハ4と ウエハ吸着部材6をウエハステージ5上に移動させる (図5b)。次に、搬送アーム15aを下降させるかある いは、ウエハステージ5を上昇させることによって、ウ エハ吸着部材6をウエハステージ5上に載置し磁力等で 固定する。最後に、搬送アーム15 a を退避させる(図 4 c)。本装置は、図4の例に比べて搬送アームを短く できるという利点を有する。

【0034】ととで、ウエハ4をウエハ格納室8にスト ックする場合には、ウエハ吸着部材6をウエハステージ 5から搬送アーム9aに受け渡す手順となり、上記の手 順と逆の手順を踏めばよい。また、図1に示したX線露 光装置においては、露光時にウエハのレジストを塗布し た面が水平となるようにウエハステージ5が配置されて いるが、たとえば放射光を光源とした装置においては、 照明光学系の配置によりウエハが垂直に配置される場合 が多い。このような場合には、ウエハの搬送機構9aに ウエハ吸着部材6を回転させる機構を設けるととか好ま しく、この機構によるウエハの搬送手順を図8を用いて 簡単に説明する。とのウエハ縦型配置の場合でも、まず 上記の例と同じようにウエハ吸着部材6の所定位置にウ エハを静電吸着させた状態で、ウエハ吸着部材6を搬送 アーム9 a に固定する(図8 a)。 このとき、ウエハ4 は 水平に保持されている。次に、回転機構9 b を作動させ てウエハ吸着部材6を90度回転させて、図8bに示す ようにウエハ4を垂直に配置する。次に、ウエハ4とウ エハ吸着部材6をウエハステージ5上に搬送アーム9 a で移動させる(図8c)。そして、搬送アーム9aあるい はウエハステージ5を水平方向に駆動させて、ウエハ吸 着部材6とウエハステージ5を接触させ、ウエハ吸着部 材6をウエハステージ5上に固定する。最後に、搬送ア ーム9aを退避させる(図8d)。このような構成によ り、ウエハを縦向きに配置して露光する露光装置におい ても、ウエハを容易に搬送することができる。

【0035】また、上記例においては、ウエハの吸着機構と搬送機構についての形態を説明したが、同様の機構50

を用いてマスクの吸着機構と搬送機構あるいは、ウエハ とマスク双方の吸着機構と搬送機構についても実施でき る。以下にその実施の形態をより具体的に説明するが、 本発明はこれらの形態に限定されるものではない。

(第一の発明の実施の形態)図1は、第一の発明の実施 の形態のX線投影露光装置を示している。

【0036】本装置は、X線源(不図示)と、照明光学系(不図示)と、投影結像光学系1と、マスク2を保持するマスクステージ3と、ウエハ4を保持するウエハステージ5と、前記ウエハ4を吸着するウエハ吸着部材6と、前記投影結像光学系1と前記マスクステージ3と前記ウエハステージ5を真空に保つための真空チャンバー7と、前記ウエハをストックするウエハ格納室8と、前記ウエハおよび前記ウエハ吸着部材6を搬送する搬送機構9とを有している。

【0037】本装置のX線源としてレーザープラズマX線源を用い、CCから発したX線を照明光学系を介してマスク2に照射する。Cの時の露光波長は13nmとし、マスク2は反射型のものを用いた。マスク2で反射したX線17は、投影結像光学系1を通過してウエハ4上に到達し、マスクバターンがウエハ4上に縮小転写される

【0038】前記投影結像光学系1は4枚の反射鏡で構成され、倍率は1/4であり、輪帯状の露光視野を有する。すべての反射鏡は反射面形状が非球面であり、その表面にはX線の反射率を向上させるために、Mo(モリブデン)/Si(シリカ)の多層膜がコートしてある。露光時にはマスク2 およびウエハ4をそれぞれのステージ3 および5 により走査した。ウエハの走査速度は、常にマスクの走査速度の1/4となるように同期させた。その結果、マスク上のパターンをウエハ上に1/4 に縮小して転写することができた。

【0039】ウエハ吸着部材6は図6りに示すような構造で、誘電体であるアルミナセラミックスと2枚の電極(双極型)で構成した。前記セラミックスの金属不純物量は10¹¹ atm/cm³以下とし、ウエハが金属汚染されないようにした。電極21aにはプラス400Vを、電極21bにはマイナス400Vの電圧を、それぞれ搬送アーム9aおよびウエハステージ5に設けられた電圧出力端子24bおよび24aから、電圧入力端子22bおよび22aを介して印加した。

【0040】搬送機構9は、真空チャンバ7の外側に配置し、上述した図4を用いて示した手順でウエハ4を搬送した。搬送時は、ウエハ吸着部材6に電圧を印可した状態を維持した。その結果、ウエハ4を高速で搬送しても、ウエハ4が吸着部材6上の同じ位置に保持され、ウエハ4およびウエハ吸着部材6が落下することもなく、良好なX線投影露光が行われた。

【0041】(第二の発明の実施の形態)図2は、第二の発明の実施の形態のX線投影露光装置を示している。

(8)

本装置は、上記第一の発明の実施形態におけるウエハ搬送機構をマスク搬送機構に代えたものである。すなわち、ウエハ格納室8の代わりにマスク格納室12を、またウエハ搬送機構9の代わりにマスク搬送機構13を、ゲートバルブ10の代わりにゲートバルブ14を設け、さらにマスク吸着部材11を設けた構成とし、本装置の光学仕様も、前記第一の発明の実施形態とまったく同様とした。

13

【0042】その結果、撥送時にマスク2を高速で搬送しても、マスク2がマスク吸着部材11上の同じ位置に 10保持され、マスク2およびマスク吸着部材11が落下することもなく、良好なX線投影露光が行われた。

(第三の発明の実施の形態)図3に、第三の発明の実施 の形態のX線投影露光装置を示す。

【0043】本装置は、上配第一の発明の実施形態にお けるウエハ搬送機構と、上記第二の発明の実施形態にお けるマスク搬送機構を組み合わせた構成で、それぞれの 搬送機構を真空チャンバ7内に配置したものである。す なわち、本装置はX線源(不図示)と、照明光学系(不 図示)と、投影結像光学系1と、マスク2を吸着するマ スク吸着部材11を保持するマスクステージ3と、ウエ ハ4を吸着するウエハ吸着部材6を保持するウエハステ ージ5と、前記投影結像光学系1と前記マスクステージ 3と前記ウエハステージ5を真空に保つための真空チャ ンパー7と、マスクをストックするマスク格納室12 と、ウエハをストックするウエハ格納室8と、前記マス クおよび前記マスク吸着部材11を搬送する搬送機構1 6と、前記ウエハおよび前記ウエハ吸着部材6を搬送す る搬送機構15とを有している。ととで、搬送機構1 5、16により、上述した図5を用いて示した手順でマ スク2およびウエハ4を搬送した。

【0044】本装置の光学仕様は、第一および第二の発明の実施形態と同様とし、マスクおよびウエハの搬送時には、マスク2 およびウエハ4とも吸着部材6 および11に電圧を印可した状態を維持した。その結果、マスク2 およびウエハ4 を高速で搬送しても、マスク2 およびウエハ4 が吸着部材6 および11上の同じ位置に良好に保持され、落下することもなく、良好なX線投影露光が行われた。

[0045]

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明のX線投影露光装置によれば、真空チャンバの真空を破るととなくウエハおよびマスクの交換作業ができる。その結果、通常の運転状態では真空チャンバの真空排気をする必要がなくなり、高いスループットが得られた。また、静電吸着部材を搬送する機構により、マスクおよびウエハの受け渡し機構が簡易になり、装置の製造コストを下げることができた。したがって、従来の露光装置に比べてウエハを製造するコストを下げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるX線投影露光装置の概略図であり、第一の発明の実施の形態のX線投影露光装置の概略図である。

【図2】第二の発明の実施の形態のX線投影露光装置の 概略図である。

【図3】第三の発明の実施の形態のX線投影露光装置の 概略図である。

【図4】本発明によるウェハ搬送手順を示した概略図で ある。

0 【図5】本発明による別のウエハ撤送手順を示した概略 図である。

【図6】本発明によるウエハ吸着部材、ウエハ搬送アーム、ウエハステージの断面を示す概略図である。

【図7】本発明によるウエハ吸着部材をウエハステージ へ受け渡す手順を示した図である。

【図8】本発明によるウェハ縦型配置の場合のウェハ搬送手順を示した図である。

【図9】従来のX線投影露光装置の概略図である。

【図10】は従来のウエハ撥送手順を示した概略図であ 20 る。

【主要部分の符号の説明】

1. . . 投影結像光学系

2. , , マスク

3. . . マスクステージ

4. . , ウエハ

5... ウエハステージ

6...ウエハ吸着部材

7. . . 真空チャンバ

8...ウエハ格納室

) 9. . . ウエハ搬送機構

9a.,,ウエハ搬送アーム

9 b . . . 回転機構

10...ゲートバルブ

11...マスク吸着部材

12...マスク格納室

13... マスク搬送機構

13a...マスク搬送アーム

14...ゲートバルブ

15... ウエハ搬送機構

0 15 a. . , ウエハ搬送アーム

16...マスク搬送機構

16a...マスク搬送アーム

17...x線

21、21a、21b...電極

22a, 22b... 電圧入力端子

23a, 23b, . . 配線

24a, 24b... 電圧出力端子

25a, 25b., 配線

26a, 26b... 磁力発生部材

50 27... 磁性体

16

31. X線源

32. . . 照明光学系

33. . . マスク

34...マスクステージ

35...投影結像光学系

36...ウエハ

37. . ウェハステージ

38...真空チャンバ

39... X線

*44...ウエハ

45...ウエハステージ

49. ウェハ吸着部材

50...ウエハ搬送機構

50a... 搬送アーム

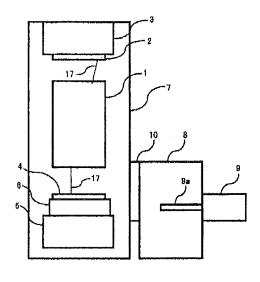
51...ウエハ格納部

52...ウエハ受け渡し機構

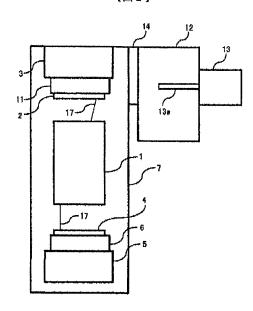
52a... 受け渡しアーム

*

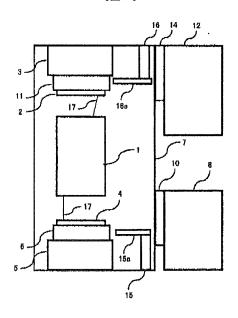
[図1]



【図2】



[図3]



【図9】

